

ISSN 1813-8586

НАНО-И МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА

- Нанотехнологии
- Зондовая микроскопия
- Микромашины и наносистемы
- Молекулярная электроника
- Биоактивные нанотехнологии
- Элементы датчиков и биочипы
- Микроэлектромеханические системы
- Микрооптоэлектромеханические системы
- Биомикроэлектромеханические системы

Том 18. №10. 2016

Е•Х•Р•О ELECTRONICA



20-я Международная выставка
электронных компонентов,
модулей и комплектующих



**25–27
апреля
2017**

Москва,
Крокус Экспо

Самая крупная
в России выставка
электронных
компонентов,
модулей
и комплектующих



Забронируйте стенд: **expoelectronica.ru**

Совместно
с выставкой



Организаторы:



+7 (812) 380 6003/07/00
electron@primexpo.ru



Рисунки к статье Л. Г. Нидеккера

«МАРШРУТ РАЗРАБОТКИ БИБЛИОТЕКИ СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ»

L. G. Nidekker

«STANDARD CELL LIBRARY DESIGN FLOW»

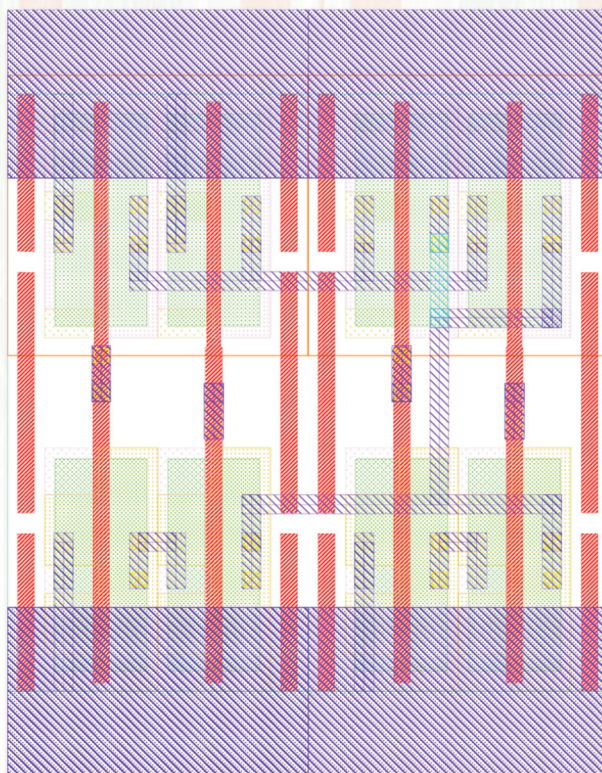


Рис. 4. Топология элемента AOI

Fig. 4. Topology of AOI element

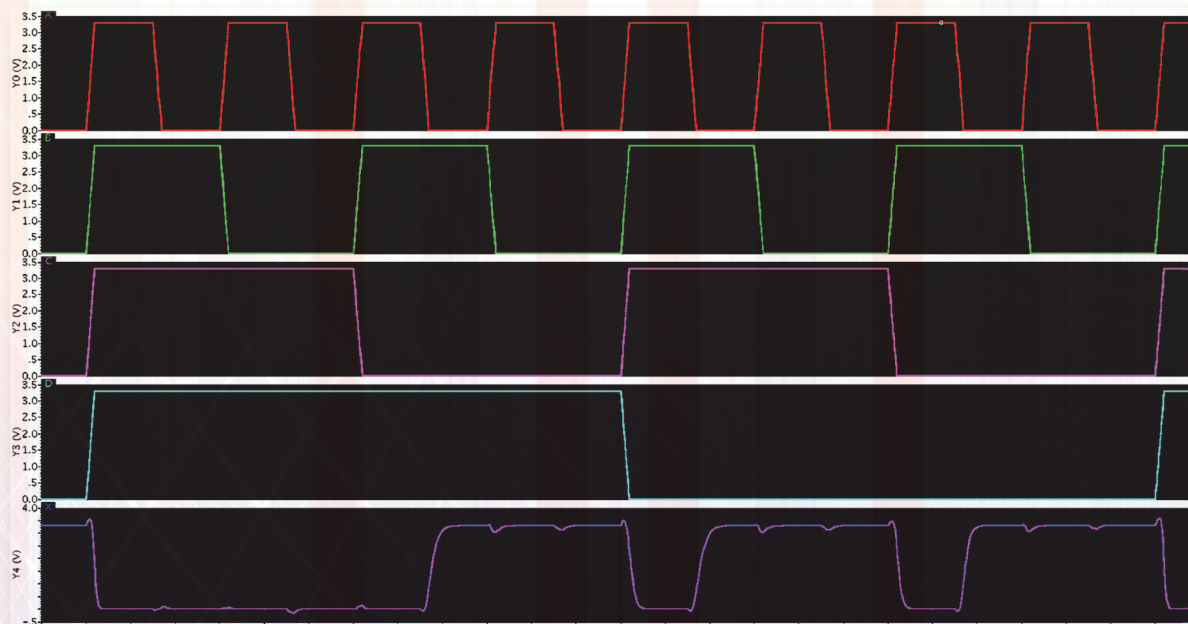


Рис. 5. Входные и выходной сигналы при симуляции элемента AOI

Fig. 5. Input and output signals during simulation of AOI element

Рисунки к статье А. Н. Саурова, С. В. Булярского, П. К. Кондратьева, А. А. Скворцова,
А. А. Павлова, Р. А. Милованова, Е. П. Кицюк

**«КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕСТОВЫХ КРИСТАЛЛОВ
С КОМПОЗИТНЫМИ ПРОВОДНИКАМИ НА ОСНОВЕ
УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК И МЕТАЛЛОВ»**

A. N. Saurov, S. V. Buliarsky, P. K. Kondratiev, A. A. Skvortsov, A. A. Pavlov, R. A. Milovanov, E. P. Kitsyuk

**«DESIGN AND FABRICATION TECHNOLOGY OF INTEGRATED CIRCUIT
WITH TEST STRUCTURES BASED ON METAL MATRIX –
CARBON NANOTUBES COMPOSITE CONDUCTORS»**

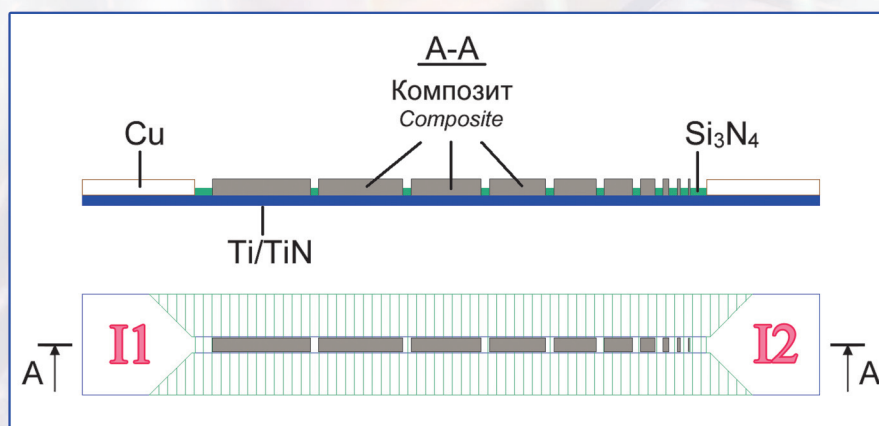


Рис. 3. Тестовая структура 2-го типа

Fig. 3. Test structure of the 2nd type

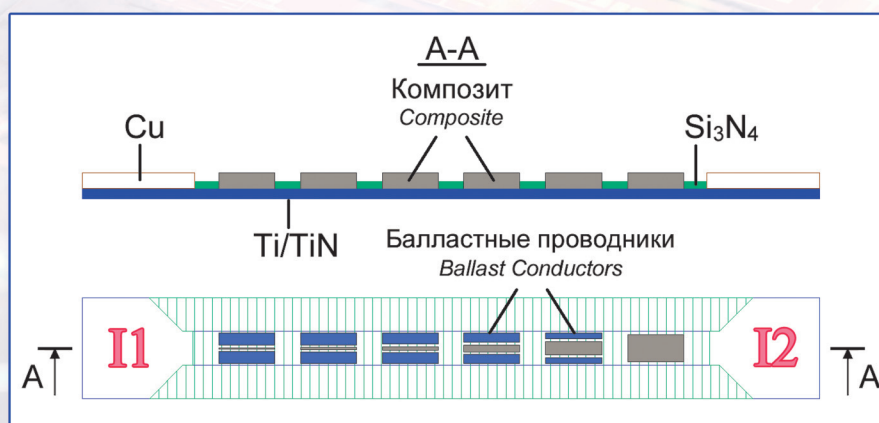


Рис. 4. Тестовая структура 3-го типа

Fig. 4. Test structure of the 3rd type

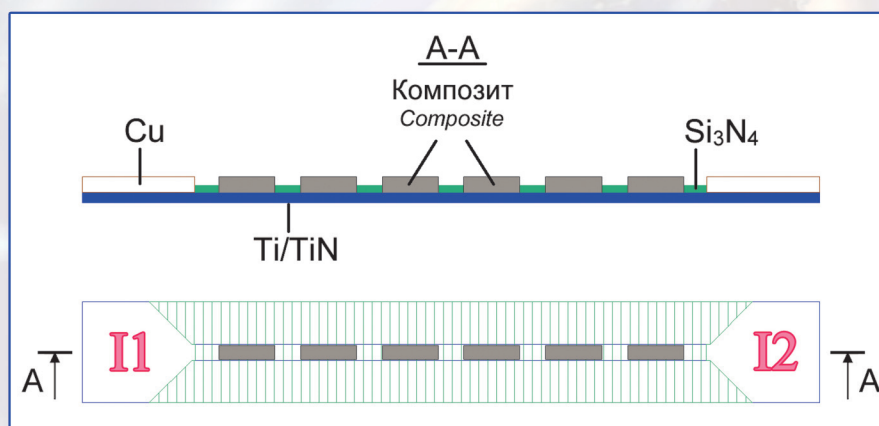


Рис. 5. Тестовая структура 4-го типа

Fig. 5. Test structure of the 4th type